

PROGRAMA NANOBIOCANCER

PRÉSTAMO: BIRF 8701-COL

SOLICITUD DE OFERTA SDO 02 -2021

ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO CON CAÑÓN DE ELECTRONES DE EMISIÓN DE CAMPO DE ALTA RESOLUCIÓN (SEM-FEG)

ADENDA No. 2

Se expide la siguiente adenda No. 2 que modifica, en lo pertinente, la Solicitud de Oferta N° 002 de 2021, así:

Modificaciones Administrativas:

1. Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación.
Punto 4. Requisitos para Calificación Posterior.

	(a) Capacidad financiera – (3) CAPITAL DE TRABAJO
IAO 38.2	<p>➤ Se acepta nuevo porcentaje para el Capital de Trabajo:</p> <p>Capital de Trabajo: $\frac{\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}}{\text{Valor de la Propuesta}} \geq 25\%$</p>

Modificaciones Técnicas:

1. Sección VII. Lista de Requisitos. Especificaciones Técnicas y Normas.
Punto 3. Óptica Electrónica:

3	Óptica Electrónica	El FEG SEM debe contar con un modo de desaceleración del haz con un rango de polarización de la platina porta muestras ajustable entre -4000V y +600 V o mayor, permitiendo un rango de energía de aterrizaje en la muestra debe estar entre 20 eV y 30 keV. También puede ser Tecnología <u>Beam Boste</u>
---	--------------------	---

Modificación: Se permite la polarización de la platina porta muestra ajustable entre 0V y -5000V quedando así:



Especificaciones Técnicas y Normas		
Criterio		Especificación
3	Óptica Electrónica	El FEG SEM debe contar con un modo de desaceleración del haz con un rango de polarización de la platina porta muestras ajustable entre -4000V y +600 V o mayor, o entre 0V y -5000V, permitiendo un rango de energía de aterrizaje en la muestra debe estar entre 20 eV y 30 keV. También puede ser Tecnología Beam Boste.

2. Sección VII. Lista de Requisitos. Especificaciones Técnicas y Normas.

Punto 8. Detectores:

Especificaciones Técnicas y Normas		
Criterio		Especificación
8	Detectores	Detector de electrones retro dispersados, de múltiples segmentos, para ser ubicado debajo de la lente. Este detector puede estar compuesto por 5 segmentos o más.

Modificación: Se incluye en la opción 8 el siguiente cambio:

Especificaciones Técnicas y Normas		
Criterio		Especificación
8	Detectores	Detector de electrones retro dispersados, de múltiples segmentos, para ser ubicado debajo de la lente. Este detector puede estar compuesto por 5 segmentos o más, o 4 segmentos, con un rendimiento equivalente o superior a las soluciones de 5 segmentos.

3. Sección VII. Lista de Requisitos. Especificaciones Técnicas y Normas.

Punto 8. Detectores:

Especificaciones Técnicas y Normas		
Criterio		Especificación
18	Sistema de Barrido y Almacenamiento de Imágenes	El SEM FEG debe permitir el modo de haz oscilante para la adquisición de patrones de canalización del área seleccionada.

Modificación: Se completa la descripción del punto 18 de la siguiente manera:

Especificaciones Técnicas y Normas		
Criterio		Especificación
18	Sistema de Barrido y Almacenamiento de Imágenes	<i>El SEM FEG debe permitir el modo de haz oscilante para la adquisición de patrones de canalización del área seleccionada, modo litografía o tecnologías similares.</i>

4. Sección VII. Lista de Requisitos. Especificaciones Técnicas y Normas.

Punto 25. Óptica Electrónica:

Especificaciones Técnicas y Normas		
Criterio		Especificación
25	Sistema de Vacío	El SEM FEG debe poder utilizar los detectores en columna mientras está en modo de bajo vacío, hasta una presión de al menos 150 Pa

Modificación: Se modifica el punto 25 de la siguiente manera:

Especificaciones Técnicas y Normas		
Criterio		Especificación
25	Sistema de Vacío	<i>El SEM FEG debe poder utilizar los detectores en columna mientras está en modo de bajo vacío y ultra alto vacío.</i>

Todas las demás disposiciones contenidas en el documento de Solicitud de Oferta y no relacionadas en esta adenda, permanecen exactamente iguales.

La presente adenda aplica a partir de la fecha de publicación, dada el dos (02) del mes de junio de 2021.

Atentamente,

 Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda
 C.C 8.354. 986
 Rector General
 Universidad Pontificia Bolivariana